## Inhalt

		Seite
	ort	
Einleit	ung	7
1	Anwendungsbereich	
2	Normative Verweisungen	
3	Begriffe, physikalische Größen, Einheiten und Abkürzungen	9
3.1	Begriffe	9
3.2	Physikalische Größen und Einheiten	12
3.3	Abkürzungen	12
4	Grenzwerte	13
4.1	Allgemeines	13
4.2	Unbeabsichtigt strahlender Teil von Beleuchtungseinrichtungen	13
4.2.1	Allgemeines	13
4.2.2	Beleuchtungseinrichtungen, die ohne Prüfung als übereinstimmend mit dem "Van der Hoofden"-Prüfverfahren gelten	13
4.2.3	Anwendung der Grenzwerte	13
4.3	Beabsichtigt strahlender Teil von Beleuchtungseinrichtungen	14
5	Allgemeine Anforderungen des "Van der Hoofden"-Prüfverfahrens	15
5.1	Messgröße	15
5.2	Versorgungsspannung und Frequenz	15
5.3	Frequenzmessbereich	15
5.4	Umgebungstemperatur	15
5.5	Messgeräteanforderungen	15
5.6	Messgeräteunsicherheit	17
5.7	Prüfbericht	17
5.8	Auswertung der Ergebnisse	17
6	Messverfahren mit dem "Van der Hoofden"-Prüfkopf	18
6.1	Allgemeines	18
6.2	Betriebsbedingungen	18
6.2.1	Betriebsbedingungen für allgemeine Beleuchtungseinrichtungen	18
6.2.2	Betriebsbedingungen für besondere Beleuchtungseinrichtungen	18
6.2.3	Betriebsbedingungen für Beleuchtungseinrichtungen mit absichtlichen Strahlern	18
6.3	Messentfernung	18
6.4	Messaufbau	19
6.4.1	Allgemeines	19
6.4.2	Messaufbau für besondere Beleuchtungseinrichtungen	19
6.5	Aufstellungsort des Prüfkopfs	20
6.6	Berechnung der Ergebnisse	20
7	Beurteilungsverfahren für absichtliche Strahler	20
7.1	Allgemeines	20
7.2	Low-Power-Ausschlussverfahren	20
7.2.1	Allgemeines	20

## DIN EN 62493 (VDE 0848-493):2016-08 EN 62493:2015

		Seite
7.2.2	Bestimmung der Gesamt-Sendeleistung	21
7.2.3	Bestimmung des "Low-Power-Ausschlusswertes"	21
7.2.4	Summation mehrerer Sender	21
7.3	Verwendung der EMF-Produktnorm für am Körper getragene Geräte	21
7.4	Verwendung der EMF-Produktnorm für Basisstationen	21
7.5	Verwendung einer anderen EMF-Norm	21
Anhar	ng A (normativ) Messentfernungen	23
Anhar	ng B (informativ) Positionierung des Prüfkopfs	24
Anhar	ng C (informativ) Expositionsgrenzwerte	29
C.1	Allgemeines	29
C.2	ICNIRP	29
C.2.1	ICNIRP:1998	29
C.2.2	ICNIRP:2010	29
C.3	IEEE	30
Anhar	ng D (informativ) Sinnvolle Mess- und Bewertungsverfahren	31
D.1	Allgemeines	31
D.2	Induziertes internes elektrisches Feld	31
D.2.1	Allgemeines	31
D.2.2	Induziertes elektrisches Feld, hervorgerufen durch das magnetische Feld; $E_{\sf eddy}$ ( $f_i$ , $d_{\sf loop}$ )	33
D.2.3	Induziertes elektrisches Feld, hervorgerufen durch das elektrische Feld; $E_{\sf cap}(f_i,d)$	38
D.3	Thermische Effekte von 100 kHz bis 300 GHz	41
D.3.1	Allgemeines	41
D.3.2	Der 100-kHz- bis 30-MHz-Beitrag zu thermischen Effekten	42
D.3.3	Der 30-MHz- bis 300-MHz-Beitrag zu thermischen Effekten	43
D.3.4	Allgemeine Schlussfolgerung für den Beitrag zum thermischen Effekte	44
Anhar	ng E (normativ) Praktisches Mess- und Bewertungsverfahren für interne elektrische Felder	45
E.1	Messung des induzierten internen elektrischen Felds	45
E.2	Berechnungsprogramm	45
E.3	Übereinstimmungskriterien der "Van der Hoofden"-Prüfkopf-Methode	46
Anhar	ng F (normativ) Schutznetzwerk	48
F.1	Kalibrierung des Schutznetzwerks	48
F.2	Berechnung der theoretischen Charakteristik des Schutznetzwerks	49
Anhar	ng G (informativ) Messgeräteunsicherheit	51
Anhar	ng H (informativ) Beleuchtungseinrichtungen, von denen angenommen wird, dass sie mit den Anforderungen der Norm übereinstimmen	53
Anhar	ng I (informativ) Absichtliche Strahler	55
I.1	Allgemeines	55
1.2	Absichtliche Strahler in Beleuchtungseinrichtungen	55
1.3	Eigenschaften von Antennen in Beleuchtungseinrichtungen	55
1.4	Expositionsabschätzungsansatz	61
141	Allgemeines	61

1.4.2	Poetimmung der durchschnittlichen Sandeleistung P	Seite
	Bestimmung der durchschnittlichen Sendeleistung $P_{\text{int,rad}}$	
1.4.3	Bestimmung des Low-Power-Ausschlusswertes $P_{\sf max}$	
1.5	Mehrere Sendeeinrichtungen in einer Leuchte	
1.6	Exposition gegenüber mehreren Leuchten	
1.7	Verweisungen in Anhang I	
	turhinweise	65
Anhar	ng ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	66
Bilde		
Bild 1	<ul> <li>Diagramm zur Beurteilung von Beleuchtungseinrichtungen und Kriterien der Erfüllung bzw.</li> <li>der Nichterfüllung</li> </ul>	14
Bild 2	– Der "Van der Hoofden"-Prüfkopf	16
Bild 3	Beispiel einer Schutznetzwerk-Schaltung	16
Bild 4	- Messaufbau	19
Bild 5	Verfahren zum Nachweis der Übereinstimmung für Sender mit beabsichtigter Strahlung als Teil einer Beleuchtungseinrichtung	22
Bild B	.1 – Positionierung des Prüfkopfs in Querrichtung von Beleuchtungseinrichtungen – Seitenansicht	
Bild B	.2 – Lage der Messpunkte in der Längenrichtung von Beleuchtungseinrichtungen – Seitenansicht	24
Bild B	.3 – Lage der Messpunkte in der Längsrichtung von Beleuchtungseinrichtungen, in der Richtung der Lichtabgabe	
Bild B	.4 – Lage der Messpunkte für Beleuchtungseinrichtungen mit rotationssymmetrischen Abmessungen	
Bild B	.5 – Lage der Messpunkte für Beleuchtungseinrichtungen mit rotationssymmetrischen Abmessungen; in der Richtung des Lichtaustritts	
Bild B	.6 – Lage der Messpunkte für Beleuchtungseinrichtungen mit gleichen Abmessungen in den x- und y-Achsen	
	.7 – Lage der Messpunkte für Beleuchtungseinrichtungen mit einseitig gesockelten Lampen (360°-Lichtaustritt)	27
	.8 – Lage der Messpunkte für Beleuchtungseinrichtungen mit getrenntem Betriebsgerät	
	.9 – Lage der Messpunkte für unabhängige elektronische Konverter	
	.10 – Lage der Messpunkte für indirekte Beleuchtung (Stehleuchte oder abgehängte Leuchte)	
	.1 – Übersicht zum Mess- und Bewertungsverfahren	
	.2 – Abstände des Prüfkopfs, der Leiterschleife und des Messaufbaus	
	.3 – Maximaler Strom in der 2 m großen Rahmenantenne (LLA) als Funktion der Frequenz	
	.4 – Induziertes internes elektrisches Feld und damit verbundene Grenzwerte	
	.5 – Beispiel einer Messung eines magnetischen Feldes mit der LLA	
	.6 – Abstände des Prüfkopfs und Messaufbaus	
	.7 – Aufzeichnung einer Kurve zu Gleichung (D.20)	
	.8 – Beispiel einer Gleichtaktstrom-Messung leitungsgeführter Emission	
	.1 – Prüfaufbau zur Kalibrierung des Netzwerkanalysators	
	.2 – Prüfaufbau zum Messen des Spannungsteilerfaktors mit einem Netzwerkanalysator	
Bild F	.3 – Berechnete theoretische Kennlinie für die Kalibrierung des Schutznetzwerks	50

## DIN EN 62493 (VDE 0848-493):2016-08 EN 62493:2015

	Seite
Bild H.1 – Flussdiagramm zur Abschätzung, ob die Anforderungen dieser Norm eingehalten werden, ohne das der Faktor <i>F</i> gemessen/ermittelt wird	54
Bild I.1 – Leuchte mit einer strahlenden Antenne in einem Raum	57
Bild I.2 – Auswirkungen einer leitenden Decke/Fläche	58
Bild I.3 – Elektrisches Feld eines kleinen elektrischen Dipols: analytische Formel versus Fernfeldnäherung	59
Bild I.4 – Elektrisches Feld als Funktion des Abstands, der Antennenverstärkung und der Eingangsleistung (Fernfeldnäherung)	60
Bild I.5 – Auswirkungen von gepulsten Signalen auf die durchschnittliche Exposition	62
Tabellen	
Tabelle 1 – Physikalische Größen und Einheiten	12
Tabelle 2 – Einstellungen des Messempfängers oder Spektrumanalysators	15
Tabelle A.1 – Beleuchtungseinrichtungen und Messentfernungen	23
Tabelle C.1 – Basisgrenzwerte für die Exposition der Bevölkerung bei zeitveränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern für Frequenzen zwischen 100 kHz und 10 GHz	29
Tabelle C.2 – Basisgrenzwerte für die Exposition der Bevölkerung bei zeitveränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern für Frequenzen bis 10 MHz	29
Tabelle C.3 – IEEE-Basisgrenzwerte für die Bevölkerung	30
Tabelle C.4 – IEEE-Basisgrenzwerte zwischen 100 kHz und 3 GHz für die Bevölkerung	30
Tabelle D.1 – Berechnungen des internen elektrischen Felds	34
Tabelle D.2 – Berechnungen der Beiträge des Stromversorgungsnetzes	40
Tabelle D.3 – Frequenzschritte für die Amplitudenaddition, die 1,11 multipliziert mit $B_6$ ergeben	41
Tabelle D.4 – Frequenzschritte für die Leistungsaddition, die 0,833 multipliziert mit $B_6$ ergeben	42
Tabelle D.5 – Feldstärkegrenzwerte nach CISPR 15	44
Tabelle E.1 – Leitfähigkeit als Funktion der Frequenz (siehe IEC 62311, Tabelle C.1)	46
Tabelle G.1 – Unsicherheitsberechnung für das in Abschnitt 5 und Abschnitt 6 beschriebene Messverfahren im Frequenzbereich von 20 kHz bis 10 MHz	51
Tabelle G.2 – Kommentare und Informationen zu Tabelle G.1	52
Tabelle I.1 – Überblick über Funktechniken, die für Beleuchtungsanlagen genutzt werden können	56